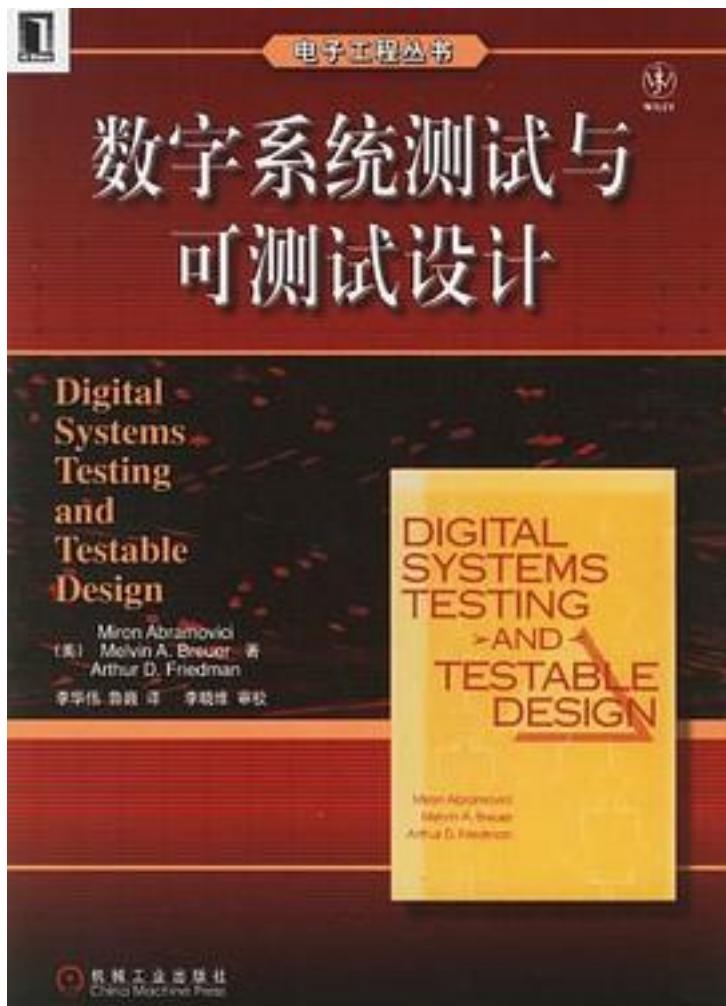


数字系统测试与可测试设计



[数字系统测试与可测试设计 下载链接1](#)

著者:阿布拉莫维奇

出版者:机械工业出版社

出版时间:2006-8

装帧:简装本

isbn:9787111192374

本书系统地介绍数字系统测试理论和方法，包括测试生成、故障模型、故障模拟、可测

试性设计、内建自测试等内容。本书共分为三部分：第一部分介绍数字系统、数字微系统芯片缺陷的来源、逻辑描述的方法等；第二部分介绍数字系统的可测试性设计理论和方法、内建自测试BIST、测试数据压缩方法等；第三部分主要讨论系统测试的方法。本书概念清晰、层次分明、定义和证明准确、算法推导和阐述简练。每章附有大量练习题可帮助读者消化吸收所学的概念。

本书可供数字系统设计相关技术人员参考，也可作为高等院校相关专业高年级本科生或研究生的教材。

作者介绍：

目录：

[数字系统测试与可测试设计 下载链接1](#)

标签

测试

数字

可测性设计

IC

评论

“what the fuck am ic reading”

[数字系统测试与可测试设计 下载链接1](#)

书评

[数字系统测试与可测试设计 下载链接1](#)